

# ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ОКСИДЕ АЛЮМИНИЯ ПО СПЕКТРАМ ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ

# ГАДЖИЕВА Н.Н.

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана AZ 1143, г.Баку, пр.Г.Джавида 31a, e-mail:nushaba6@mail.ru, тел: 4393413

В работе представлены результаты исследований радиационных дефектов в  $\gamma$ -облученном дисперсном оксиде алюминия по спектрам диффузного отражения. Показано, что  $\gamma$ -облучение  $Al_2O_3$  наводит поглощение в области  $h_{V} \leq 69B$ , обусловленное генерацией электронных (F<sup>+</sup>) и дырочных (V) центров. Обнаружена многокомпонентная структура V центров при  $h_{V}=2,5-3,2$  эВ с максимумами при  $\lambda=375,390$  и 410 нм, соответствующих дырочным центрам типа V<sup>-</sup>, V<sup>-</sup> и V<sub>OH</sub><sup>-</sup> Изучение кинетические закономерности накопления V-центров в зависимости от поглощенной дозы. Оценена общая концентрация дырочных центров.

### введение

Интерес к изучению оптических спектров оксида алюминия (ү-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)\* (\*-здесь и далее имеются ввиду у форма Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) обусловлен применением его как алсорбента и носителя лля катализаторов превращений углеводородов радиационнов Принципиальная [1-3]. гетерогенном катализе регулирования каталитических возможность И адсорбционных свойств  $Al_2O_3$ под действием ионизирующих излучений достаточно обоснована [4-6]. Вместе тем, некоторые механизмы с каталитической активности полностью невыяснены и дальнейшей расшифровки. требуют Активность катализаторов предопределяется их приповерхностным состоянием: дисперсностью порошков, наличием поверхностных гидроксильных групп, примесей и т.п. Одним из информативных методов изучения приповерхностных явлений спектроскопия, является оптическая которая позволяет получить также сведения о структуре образующихся дефектных центров и выявить механизм И закономерности образования И накопления генерируемых электронов и дырок под действием у-облучения. Исследование радиационных дефектов - парамагнитных центров в облученном оксиде алюминия проводилось, в основном, методом ЭПР-спектроскопии [7], а оптическая спектроскопия применена при изучении дырочных (V) центров в уоблученных монокристаллах корунда (α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) [8].

В настоящей работе представлены результаты исследований кинетических закономерностей образования и накопления радиационногенерированных электронных (F<sup>+</sup>) и дырочных (V) центров в γ-облученных порошкообразных образцах оксида алюминия. Использован метод спектроскопии диффузного отражения (ДО) в спектральной области 185-900 нм в сочетании с методами ИК - спектроскопии и фотолюминесценции.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объектами исследований являлись мелкодисперсные порошкообразные образцы Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (S<sub>vn</sub>=220 м<sup>2</sup>/г) с размерами гранул 40≤d≤160 мкм и содержанием примесей Fe, Cr, Co ≤10<sup>-3</sup> масс.%. Из фракционированных порошков подбирались фракции образцов с размерами d=40, 80, 120 и 160 мкм, которых средние значения определялись микроскопически. С целью очистки от мелких частиц каждая фракция порошка Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в отдельности промывалась в дистиллированной воде, затем высушивалась в среде Ar. Образцы вакуумировались при P=10<sup>-5</sup> Па и температурах Т=300 и 473 К.

Образцы облучались при комнатной температуре ү-лучами <sup>60</sup>Со мощностью дозы Д=2,7 Гр·с<sup>-1</sup>. При этом поглощенная доза, определенная ферросульфатным дозиметром составляла Д=5÷80 к Гр.

Спектры диффузного отражения (ДО) необлученных и у-облученных образцов измерялись относительно эталона (BaSO<sub>4</sub>) в области 185÷900 нм на спектрофотометре "Specord M40" с постоянным весом порошка. По результатам спектральных измерений разностные спектры строились  $\Delta R(\lambda)=R(\lambda)-R_0(\lambda)$ , где  $R_0(\lambda)$  и  $R(\lambda)$  спектры ДО образца после воздействия ло И (термовакуумирования, у-облучения). Положительные величины  $\Delta R(\lambda)$ соответствуют значения поглощению, наведенному воздействием.

Определялись оптические плотности полос поглощения по формуле

$$D = -\lg \Delta R \tag{1}$$

Спектральная зависимость коэффициента поглощения  $\alpha(h\nu)$  для  $Al_2O_3$  рассчитывалась из спектров ДО по соотношению

$$\alpha(h\nu) = Af(R(h\nu)) = A\frac{(1-R(h\nu))^2}{R(h\nu)}$$
(2)

здесь R(hv) – спектральная зависимость коэффициента диффузного отражения. Коэффициент А рассчитан по оптическим постоянным Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Абсолютные значения концентрации центров поглощения оценивались по формуле Смакулы

$$N = 0.87 \cdot 10^{17} \, nf^{-1} \gamma \, \frac{\alpha}{\left(n^2 + 2\right)^2} \tag{3}$$

где n-показатель преломления (n=1,73 для hv $\leq$ 2,5 эB, n=1,6 – 1,8 для hv $\geq$ 4,1 эB) f- сила осциллятора (f=0,6 для hv=4,6 – 5,4 эB, f=0,1 для hv=1,5 – 4,4 эB) [9].

Спектры люминесценции записывались при комнатной температуре с помощью монохроматора ДФС-24 в области длин волн 200÷800 нм. Возбуждение проводилось УФ излучением N<sub>2</sub> лазера с  $\lambda_{воз}$ =337 нм и ртутной лампой ДРШ – 250 с  $\lambda_{воз}$ =313 нм. Спектры ИК-поглощения регистрировались на спектрофотометре "Specord 71IR" в области частот 4000-3000 см.

### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нами получены спектры диффузного отражения как облученных, так и необлученных ү-лучами порошкообразных образцов Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с размерами гранул d=40, 100, 120 и 160 мкм. На рис.1. приведены спектры ДО образцов оксида алюминия с размерами гранул 40 и 160 мкм до (кривые 1 и 2) и после уоблучения с поглощенной дозой 10 к Гр (кривые 1' и 2') соответственно. Как видно из рисунка, спектр Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в оптической необлученного области характеризуется наличием ряда полос поглощения. В  $\lambda = 200 - 350$ VΦ области HM обнаруживаются интенсивная широкая полоса с максимумом при

 $\lambda$ =260 нм и сравнительно узкая полоса при  $\lambda$ =280 нм. Аналогичное поглощение при λ=260 нм наблюдалось на образцах Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> -керамики, активированной лазерным излучением. Согласно [10-11], полоса поглощения при 260 нм (hv=4,8 эВ) соответствует F<sup>+</sup> центрам (вакансию кислорода с одним локализованным электроном в решетке корунда α - $Al_2O_3$ ). На полосу поглощения  $F^+$  -центров со коротковолновой стороны накладывается также полоса поглощения примесного центра Fe<sup>3+</sup> (4,84 и 6,2 эВ). Полоса поглощения при λ=280 нм (4,18 эВ) связана с примесным центром Со<sup>3+</sup>.

Видимая область спектра ( $\lambda$ =350 – 900 нм) характеризуется наличием широкой полосы с центром тяжести около  $\lambda$ =510 нм, связанная с примесями Cr<sup>3+</sup> и Co<sup>2+</sup> [12]. Следует отметить, что основная полоса поглощения Cr<sup>3+</sup> находится в вакуумной УФ области при 180 нм.





Облучение у-квантами образцов Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при Д=10 уменьшению коэффициента кГр приводит к отражения (R) во всей спектральной области. Основное изменение наблюдается в области hv=2,5 -3,2 эВ, что связано с образованием дырочных (V) центров, генерируемых под действием у-облучения. Под действием радиации максимумы полос при  $\lambda$ =280 и 510нм смещаются до  $\lambda$ =290 и 560 нм соответственно. По-видимому, смещение это обусловлено изменением зарядного состояния примесей  $Co^{3+} \rightarrow Co^{2+}$  и  $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$  [13].

Наличие примесей в Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> контролировалось по спектрам фотолюминесценции. Обнаружено свечение при  $\lambda$ =690 и 750 нм, что характерно для ионов хрома Cr<sup>3+</sup>  $\rightarrow$  Cr<sup>2+</sup> и железа Fe<sup>3+</sup> $\rightarrow$  Fe<sup>2+</sup>. Анализ спектров ДО как необлученных, так и  $\gamma$ -облученных образцов с различной дисперсности порошков показывает, что с

уменьшением размеров гранул от 160 до 40 мкм во всей оптической области увеличиваются значения R в соответствии с законом Кубелка-Мунка-Гуревича [14] (рис.1). При этом, порошки с размерами d=40 мкм оказываются более чувствительными к воздействию γ-излучения. Поэтому, в дальнейшем при детальном изучении радиационных дефектов – генерируемых электронных (F<sup>+</sup>) и дырочных (V) центров нами использован порошкообразный оксид алюминия с размерами гранул d=40 мкм.

На рис.2 показаны спектры поглощения Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в областях F<sup>+</sup> (hv=4 – 6 эВ) и V (hv=2,5 – 3,2 эВ) центров при различных значениях поглошенной дозы у-облучения. Как видно из рисунка, с увеличением дозы у-облучения интенсивность полосы поглощения при λ=260 нм (hv=4,8 эВ) растет, появляется другая полоса  $F^+$  -центров при  $\lambda$ =230 нм (hv=5,4 эВ), и происходит перераспределение их интенсивностей. В hv=2,5 - 3,2 эВ наблюдаются полосы области поглощения с максимумами  $\lambda=375$ , 390 и 410 нм, которые соответствуют дырочным центрам типа V, (V<sup>-</sup>(V<sup>=</sup>)) -катионная вакансия, V<sup>=</sup> и V<sub>OH</sub><sup>-</sup> захватившая две (одну) дырки на ионах кислорода первой координационной сферы, V<sub>OH</sub> - катионная вакансия, соседствующая с гидроксильной группой, захватившая дырку) [5]. При исследовании монокристалла α -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> после γ-облучения, авторами [8] наблюдалась также широкая полоса поглощения с центром при 400 нм, которая отнесена к суммарным дырочным центрам. Показано, что одним из компонентов этой широкой полосы при  $\lambda$ =410 нм является V<sub>OH</sub> - центр, связанный с локализованной колебательной полосой при 3316 см<sup>-1</sup>.

Изучение нами ИК-спектров оксида алюминия до и после у-облучения в области валентных колебаний ОН<sup>-</sup>, показало, что облучение приводит к исчезновению полосы v=3280 см<sup>-1</sup> и появлению новой v=3360 см<sup>-1</sup> . Полоса при v=3280 см<sup>-1</sup> полосы относится к ОН иону, который находится в кислородной вакансии. Полоса при v=3360 см<sup>-1</sup> соответствует иону ОН, который находится в вакансии алюминия и захватывается дыркой. После отжига Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при T=373 К полоса оптического поглощения при λ=410 нм исчезает, что указывает на ее связь с V<sub>OH</sub>. В зависимости от поглощенной дозы оптический спектр в области Vцентров трансформируется, и происходит перераспределение интенсивностей этих трех полос, соответствующих V-,  $V^{=}$  и  $V_{OH}^{-}$  центрам.

На рис.3 приведена зависимость оптической плотности полос суммарных дырочных V- центров и их общей концентрации от поглощенной дозы в γ-облученном Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Как видно, кинетические особенности состоят из линейной области при Д≥2 кГр, обусловленной в основном генерацией активных дырочных центров и стационарной области насыщения при Д≥35 кГр. Наблюдаемая кинетическая закономерность накопления V- центров полностью согласуется с результатами работы по ЭПР - исследованию парамагнитных центров в *γ*-облученном оксиде алюминия [7].



Рис.2 Спектры поглощения облученного с дозами 10 (кривая 1) и 30 кГр (кривая 2) γ- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Dоптическая плотность).



Рис.3 Зависимость оптической плотности полосы дырочных V-центров (кривая 1) и их общей концентрации (кривая 2) от поглощенной дозы в облученном у- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Облучение  $\gamma$ -квантами дисперсного  $Al_2O_3$  наводит поглощение в области  $hv \le 6$  эВ, которое связано с образованием электронных (F<sup>+</sup>) и дырочных (V) центров. Показано, что полоса поглощения V-центров при hv=2,5-3,2 эВ состоит из нескольких компонент с максимумами при  $\lambda=375$ , 390 и 410 нм, соответствующие дырочным центрам V<sup>-</sup>, V<sup>=</sup> и V<sub>OH</sub><sup>-</sup> - типа. Изучены кинетические закономерности накопления V-центров в зависимости от поглощенной дозы. Оценена общая концентрация дырочных центров.

- [1]. Н.Н.Гаджиева, А.А.Гарибов. ЖПС, 1998, т65, №1, с.34-39.
- [2]. Н.Н.Гаджиева, Э.А.Самедов, Х.И.Абдуллаева. ЖПС, 1995, т62, с.44-48.
- [3]. Т.Н.Агаев. Автореферат на соискание уч.ст.к.х.н. «Роль алюминиевых акцепторных центров при радиационнокаталитическом действии оксидных катализаторов в процессе разложения воды» Баку, 1993.
- [4]. Я.А.Валбис, М.Е.Спрингис. Сб.научных трудов «Радиационно-стимулированные процессы в широкощелевых материалах» Рига, 1987, с.99-107.
- [5]. В.Н.Кузнецов, А.А.Лисаченко. Кинетика и катализ. 1991, т32, в1, с.222-225.
- [6]. В.Н.Дорошенко, В.Н.Каурковская, А.П.Шиманский идр. ХВЭ, 2003, т37, №4,260

- [7]. Н.Г.Шириков, В.Ф.Ануфриенко, Л.А.Сазонов. Докл.АН СССР, сер.физическая химия, 1973, т208, №4, с.902-905.
- [8]. T.I.Turner and I.H.Crawford, J.Solid State Commun. 1975, v17, p.167-169.
- [9]. А.В.Кабышев, Ф.В.Конусов. Поверхность, 2003, №9, с.51-60.
- [10]. Г.А.Шафеев, Квантовая электроника, 1997, т24, №12, с.1137-1144.
- [11]. В.С.Кортов, И.И.Мильман. Изв.вузов, Физика, 1996, т39, №11, с.145
- [12]. H.H.Tippins.Phys.Rev.1970, V1, N1, p.126-135.
- [13]. П.Н.Яровой, О.В.Овчинникова, С.А.Скорникова, Н.В.Чистофорова. Люминесценция катализаторов при лазерном возбуждении, Ангарск. АГТА, 2003, 104с.
- [14]. Т.В.Розенберг, М.Ю.Сахновский и С.Г.Гуминевский. Опт. и спектр. 1967, т23, в5, с.797-806.